

英飞凌汽车级MOSFET

英飞凌汽车级40V 175°C N沟道增强型OptiMOS™ 7



特点

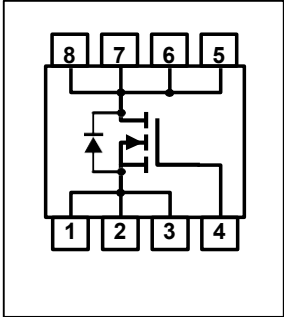
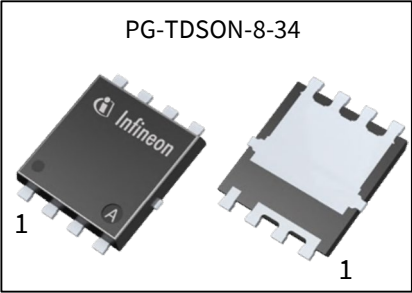
- 适用于汽车应用的OptiMOS™功率MOSFET
- N 沟道 - 增强型 - 逻辑电平
- 严苛于AEC-Q101 的扩展认证
- 加强电气测试
- 坚固的设计
- MSL1 回流焊峰值温度高达 260°C
- 工作温度 175°C
- 符合 RoHS 标准
- 100% 雪崩测试

潜在应用

通用汽车应用

产品验证

汽车应用认证。根据 AEC-Q101 进行产品验证



产品概述

V_{DS}	40	V
$R_{DS(on)}$	0.91	m Ω
I_D (chip limited)	275	A

Type	Package	Marking
IAUCN04S7L009	PG-TDSON-8-34	7N04L009

本数据手册的原文使用英文撰写。为方便起见，英飞凌提供了译文；由于翻译过程中可能使用了自动化工具，英飞凌不保证译文的准确性。为确认准确性，请务必访问 infineon.com 参考最新的英文版本（控制文档）。



目录

描述 1

最大额定值 3

热特性 4

电气特性 4

电气特性图 6

封装外形和尺寸 10

修订记录 11

免责声明 12

最大额定值

$T_j=25\text{ °C}$ ，除非另有规定

Parameter	Symbol	Conditions	Value	Unit
Continuous drain current	I_D	$V_{GS}=10\text{ V}$, Chip limitation ^{1,2)}	275	A
		$V_{GS}=10\text{ V}$, DC current	175	
		$T_a=100\text{ °C}$, $V_{GS}=10\text{ V}$, R_{thJA} on 2s2p ^{2,3)}	40	
Pulsed drain current ²⁾	$I_{D,pulse}$	$T_c=25\text{ °C}$, $t_p=100\text{ }\mu\text{s}$	840	
Avalanche energy, single pulse ²⁾	E_{AS}	$I_D=67\text{ A}$	145	mJ
Avalanche current, single pulse	I_{AS}	–	133	A
Gate source voltage	V_{GS}	–	± 16	V
		limited to duty factor of 1%	+20	V
Power dissipation	P_{tot}	$T_c=25\text{ °C}$	129	W
Operating and storage temperature	T_j, T_{stg}	–	-55 ... +175	°C

热特性²⁾

Parameter	Symbol	Conditions	Values			Unit
			min.	typ.	max.	
Thermal resistance, junction - case	R_{thJC}	—	—	0.6	1.2	K/W
Thermal resistance, junction - ambient ³⁾	R_{thJA}	—	—	27	—	

电气特性

T_j=25 °C, 除非另有规定

Parameter	Symbol	Conditions	Values			Unit
			min.	typ.	max.	

静态参数特性

Drain-source breakdown voltage	$V_{(BR)DSS}$	$V_{GS}=0\text{ V}$, $I_D=1\text{ mA}$	40	—	—	V
Gate threshold voltage	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}$, $I_D=60\text{ }\mu\text{A}$	1.2	1.5	1.8	
Zero gate voltage drain current	I_{DSS}	$V_{DS}=40\text{ V}$, $V_{GS}=0\text{ V}$, $T_j=25\text{ }^\circ\text{C}$	—	—	1	μA
		$V_{DS}=40\text{ V}$, $V_{GS}=0\text{ V}$, $T_j=100\text{ }^\circ\text{C}^{2)}$	—	—	14	
Gate-source leakage current	I_{GSS}	$V_{GS}=16\text{ V}$, $V_{DS}=0\text{ V}$	—	—	100	nA
Drain-source on-state resistance	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=4.5\text{ V}$, $I_D=88\text{ A}$	—	1.10	1.29	m Ω
		$V_{GS}=10\text{ V}$, $I_D=88\text{ A}$	—	0.80	0.91	
Gate resistance ²⁾	R_G	—	—	1.2	—	Ω

Parameter	Symbol	Conditions	Values			Unit
			min.	typ.	max.	

动态参数特性²⁾

Input capacitance	C_{iss}	$V_{GS}=0\text{ V}, V_{DS}=20\text{ V}, f=1\text{ MHz}$	–	4388	5704	pF
Output capacitance	C_{oss}		–	2203	2860	
Reverse transfer capacitance	C_{rss}		–	75	112	
Turn-on delay time	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=20\text{ V}, V_{GS}=10\text{ V}, I_D=88\text{ A}, R_G=3.5\ \Omega$	–	5	–	ns
Rise time	t_r		–	5	–	
Turn-off delay time	$t_{d(off)}$		–	40	–	
Fall time	t_f		–	19	–	

栅极电荷特性²⁾

Gate to source charge	Q_{gs}	$V_{DD}=20\text{ V}, I_D=88\text{ A}, V_{GS}=0\text{ to }10\text{ V}$	–	12	15	nC
Gate to drain charge	Q_{gd}		–	11	17	
Gate charge total	Q_g		–	66	85	
Gate plateau voltage	$V_{plateau}$		–	2.7	–	V

反向二极管

Diode continuous forward current ²⁾	I_S	$T_C=25\text{ °C}$	–	–	175	A
Diode pulse current ²⁾	$I_{S,pulse}$	$T_C=25\text{ °C}, t_p=100\ \mu\text{s}$	–	–	840	
Diode forward voltage	V_{SD}	$V_{GS}=0\text{ V}, I_F=88\text{ A}, T_J=25\text{ °C}$	–	0.8	0.95	V
Reverse recovery time ²⁾	t_{rr}	$V_R=20\text{ V}, I_F=50\text{ A}, di_F/dt=100\text{ A}/\mu\text{s}$	–	41	61	ns
Reverse recovery charge ²⁾	Q_{rr}		–	32	64	nC

¹⁾ 实际上，电流能力受到包括客户特定的印刷电路板在内的整体系统设计的限制。

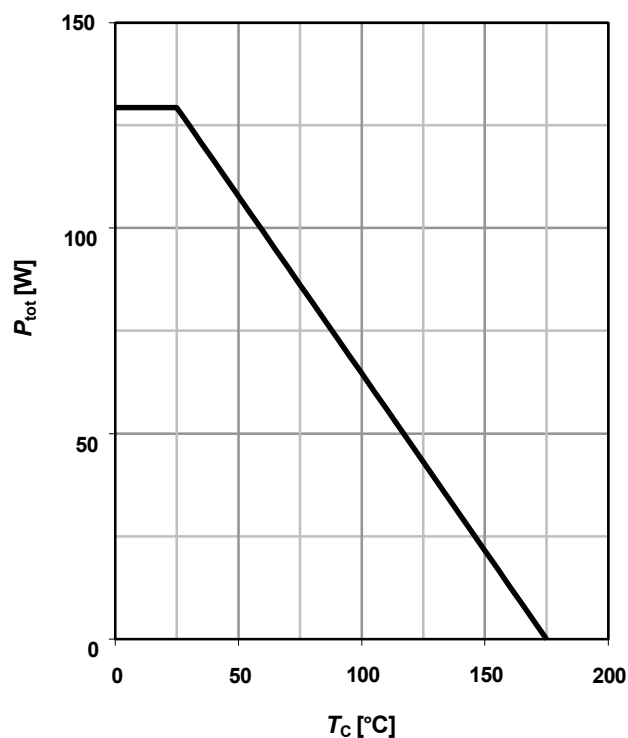
²⁾ 该参数不受限于生产测试 – 由设计标定。

³⁾ 器件放置于根据JEDEC标准 (JESD51-5, -7) 定义的 2s2p FR4 印刷电路板上。印刷电路板垂直放置在静止空气中。

电气特性图

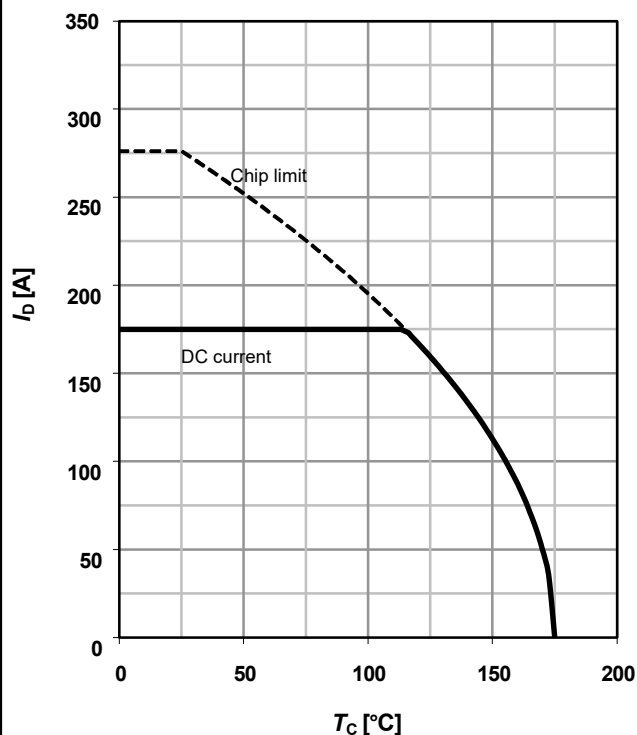
1 功率耗散

$$P_{\text{tot}} = f(T_c); V_{\text{GS}} \geq 6 \text{ V}$$



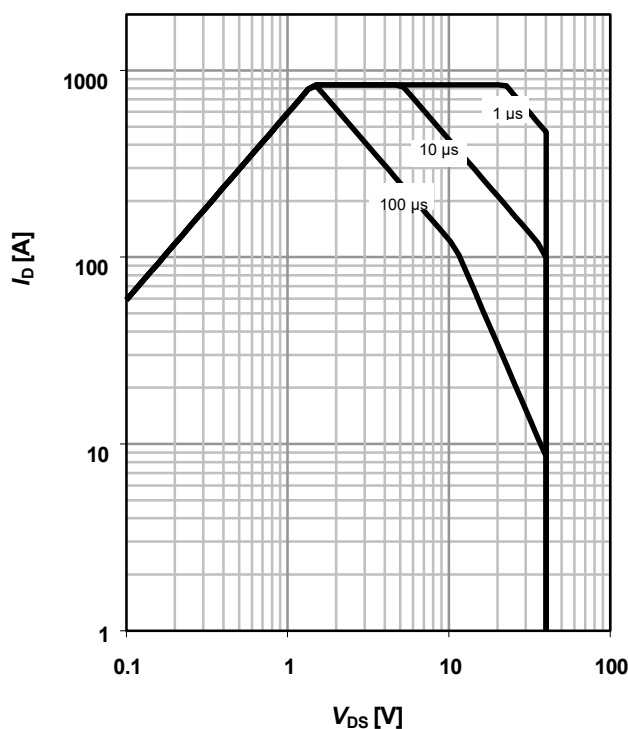
2 漏极电流

$$I_D = f(T_c); V_{\text{GS}} \geq 6 \text{ V}$$



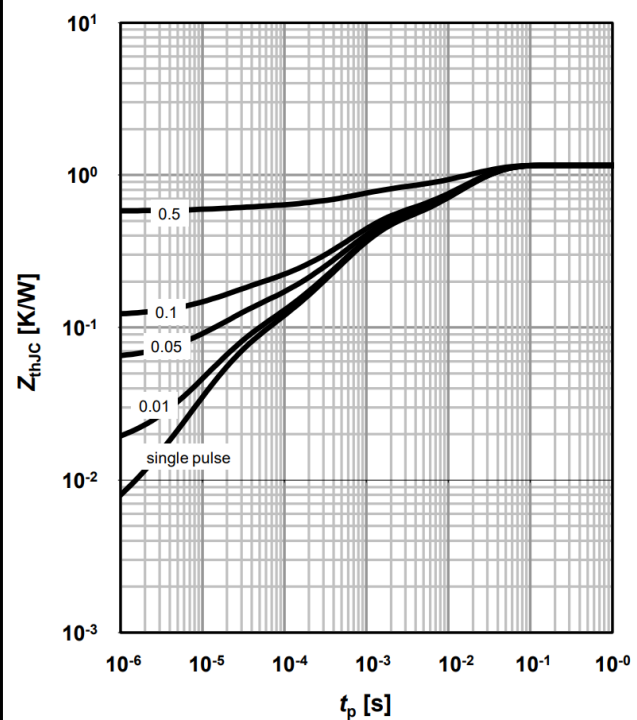
3 安全工作区

$$I_D = f(V_{\text{DS}}); T_c = 25^\circ\text{C}; D = 0; \text{parameter: } t_p$$



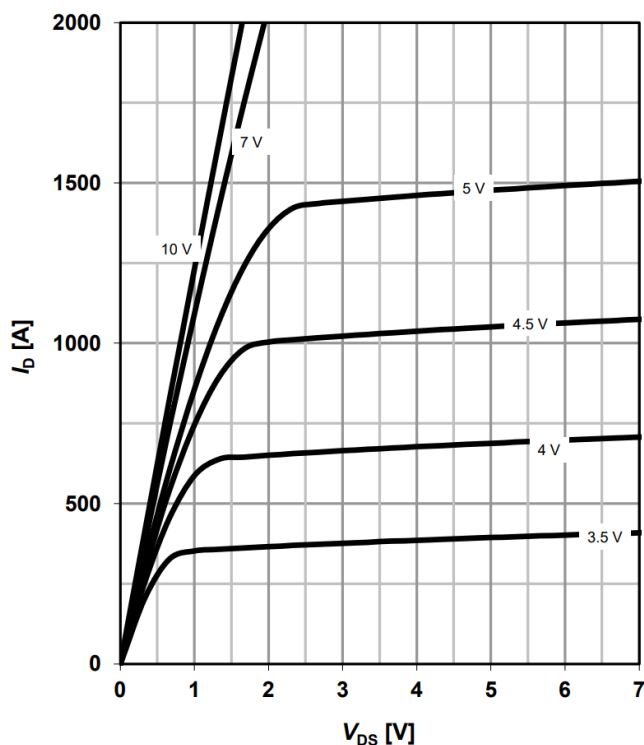
4 最大瞬态热阻抗

$$Z_{\text{thJC}} = f(t_p); \text{parameter: } D = t_p/T$$



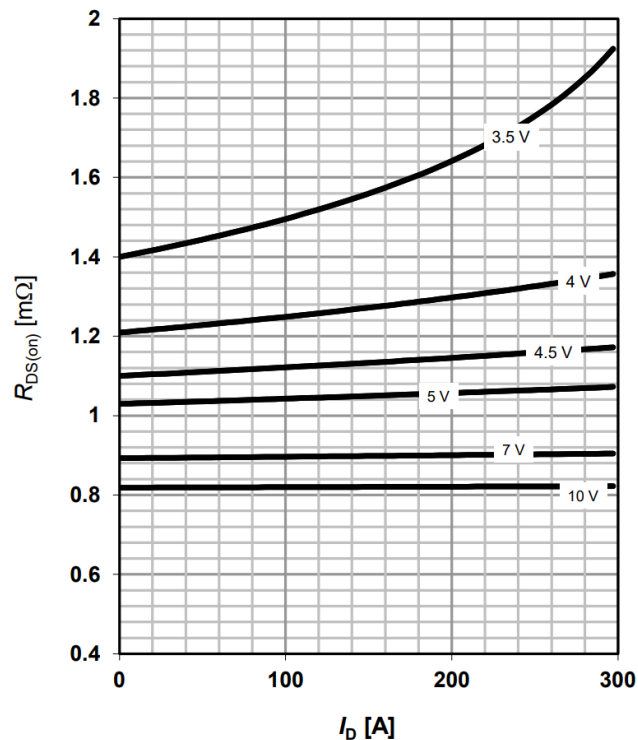
5 典型输出特性

$I_D = f(V_{DS}); T_j = 25^\circ\text{C}; \text{parameter: } V_{GS}$



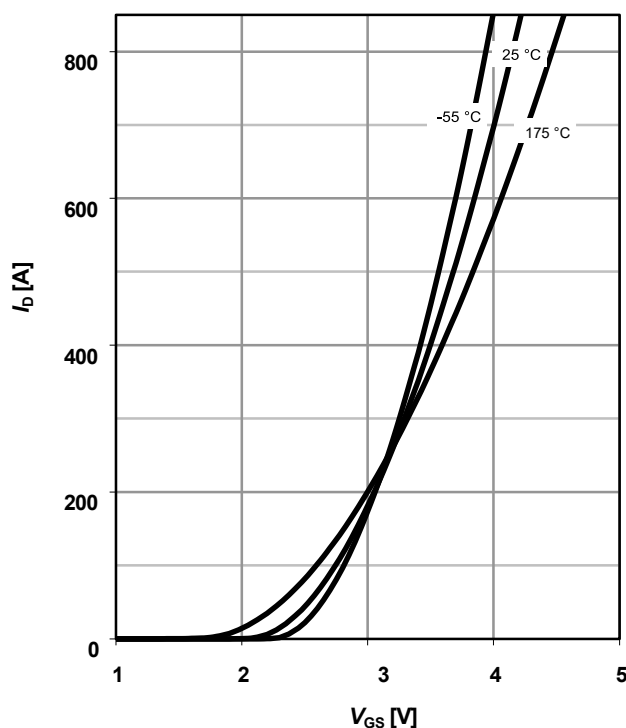
6 典型漏源导通电阻

$R_{DS(on)} = f(I_D); T_j = 25^\circ\text{C}; \text{parameter: } V_{GS}$



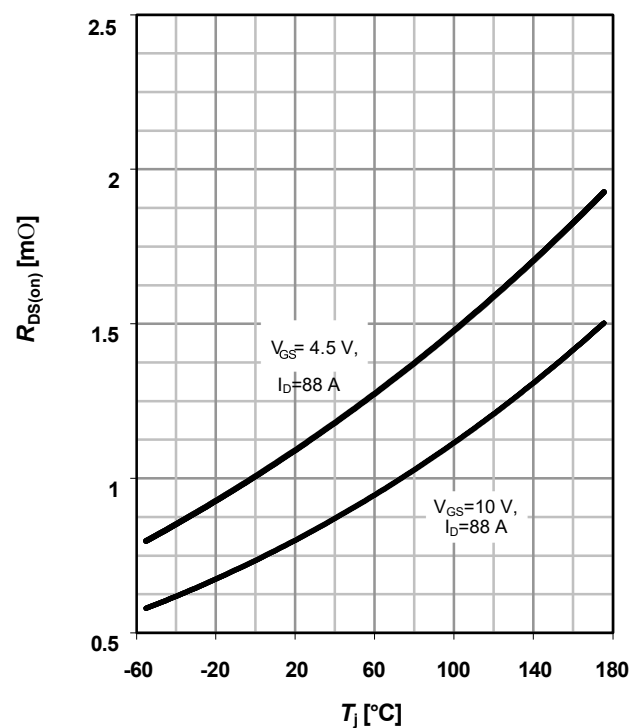
7 典型转移特性

$I_D = f(V_{GS}); V_{DS} = 6\text{V}; \text{parameter: } T_j$



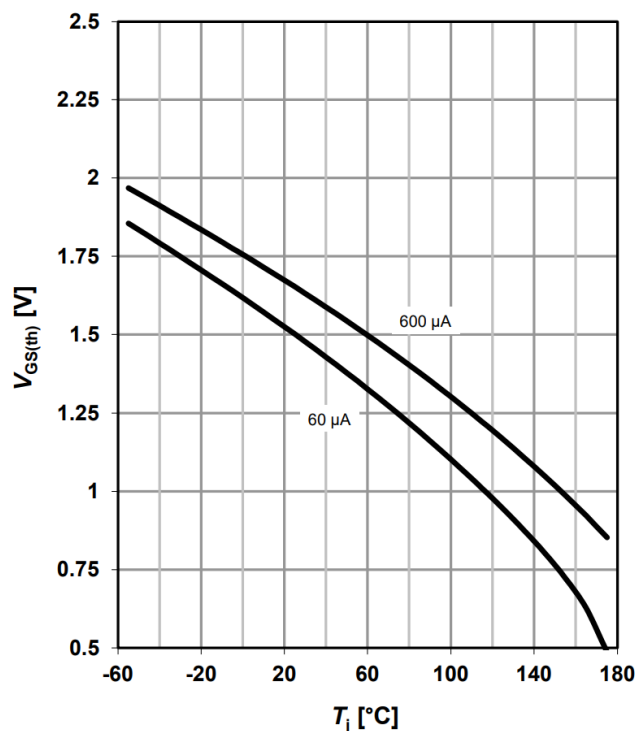
8 典型漏源导通电阻

$R_{DS(on)} = f(T_j); \text{parameter: } I_D, V_{GS}$



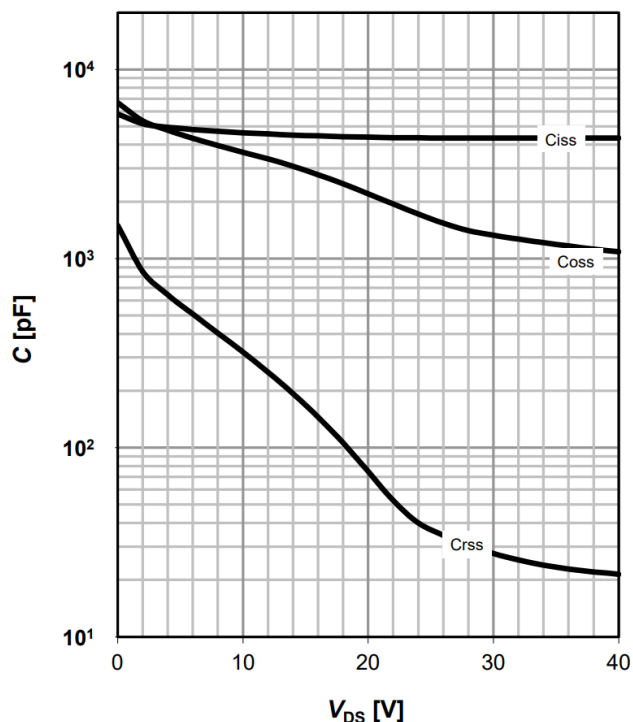
9 典型栅极阈值电压

$V_{GS(th)} = f(T_j)$; $V_{GS} = V_{DS}$; parameter: I_D



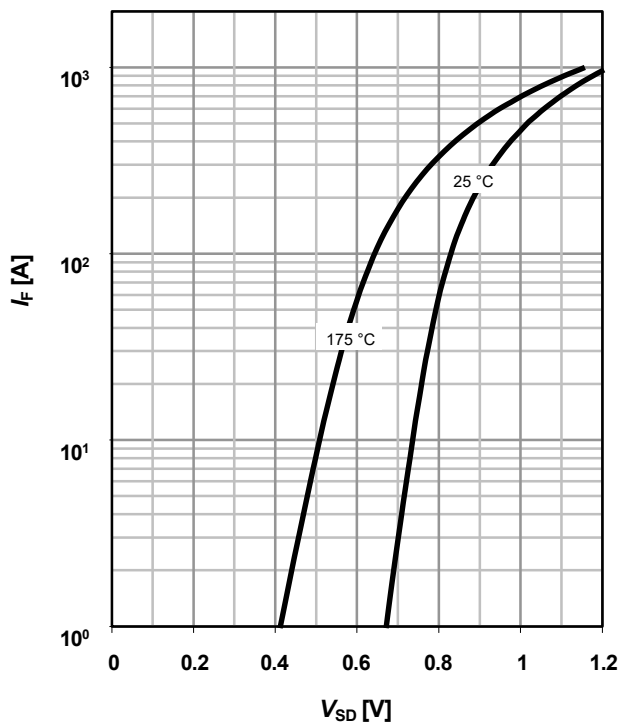
10 典型电容值

$C = f(V_{DS})$; $V_{GS} = 0$ V; $f = 1$ MHz



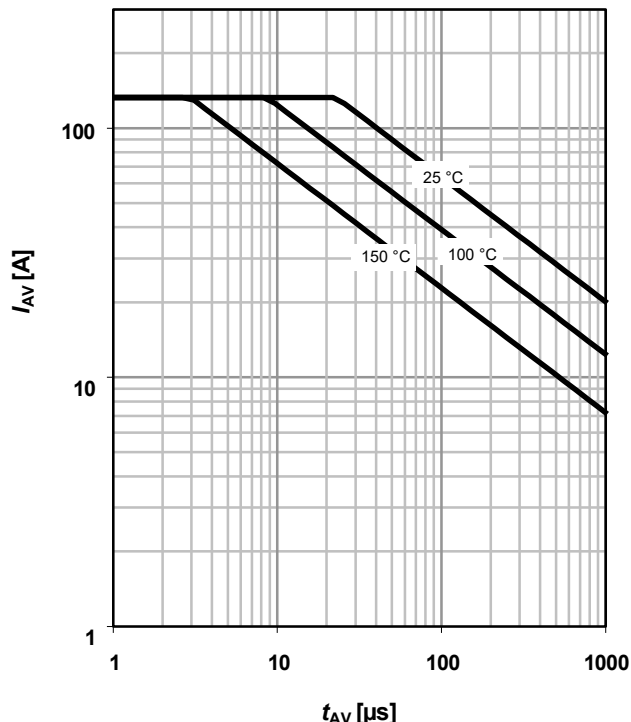
11 典型二极管正向导通特性

$I_F = f(V_{SD})$; parameter: T_j



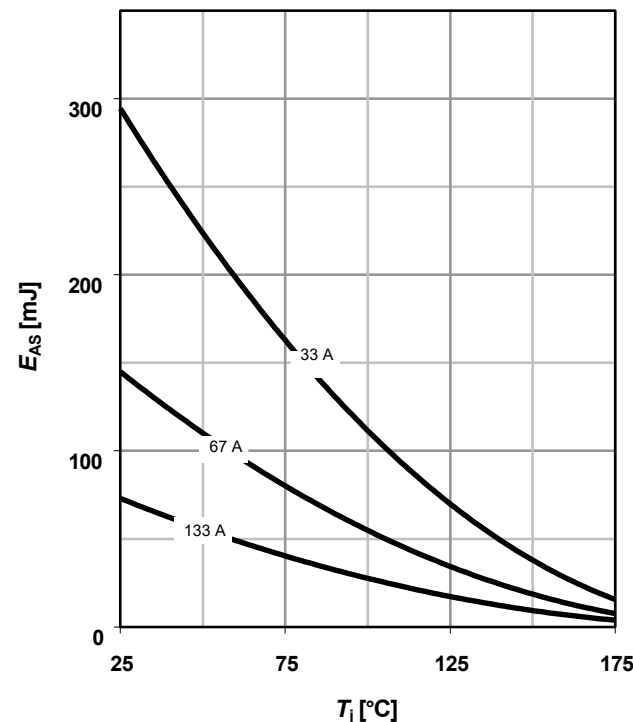
12 典型雪崩特性

$I_{AS} = f(t_{AV})$; parameter: $T_{j(start)}$



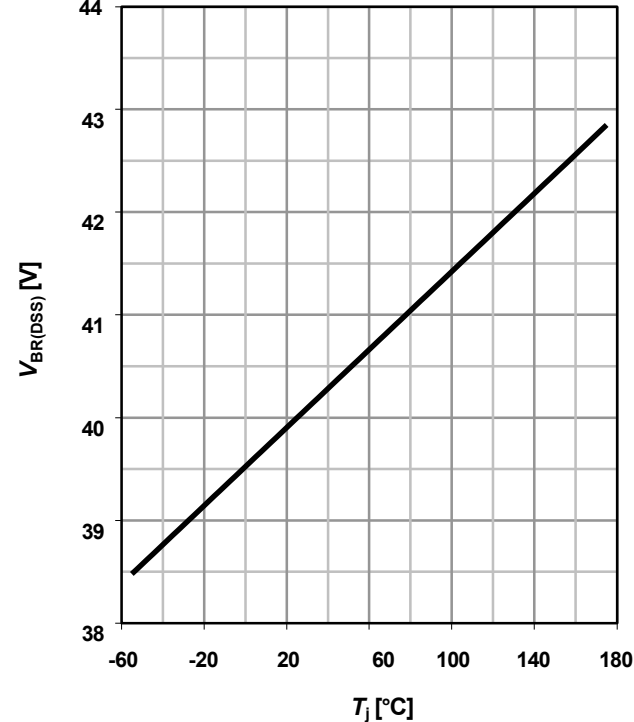
13 典型雪崩能量

$E_{AS} = f(T_j)$; parameter: ID



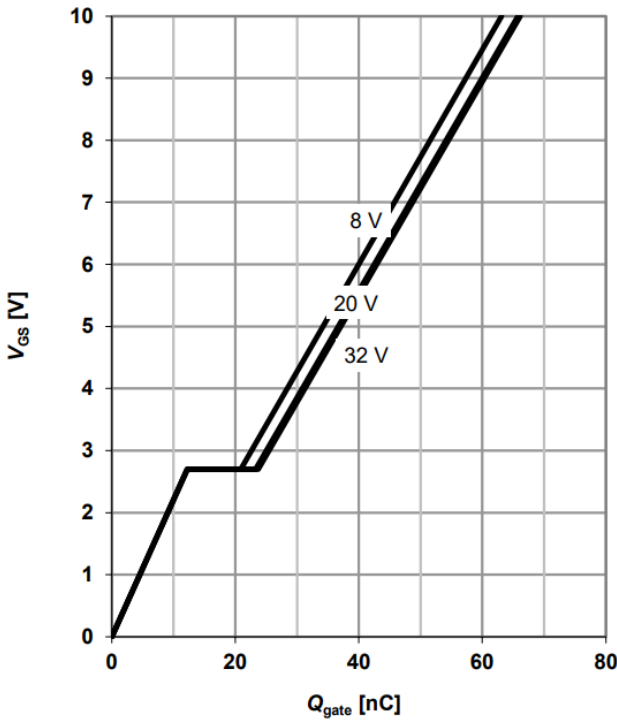
14 漏源击穿电压

$V_{BR(DSS)} = f(T_j)$; $I_{D_typ} = 1$ mA

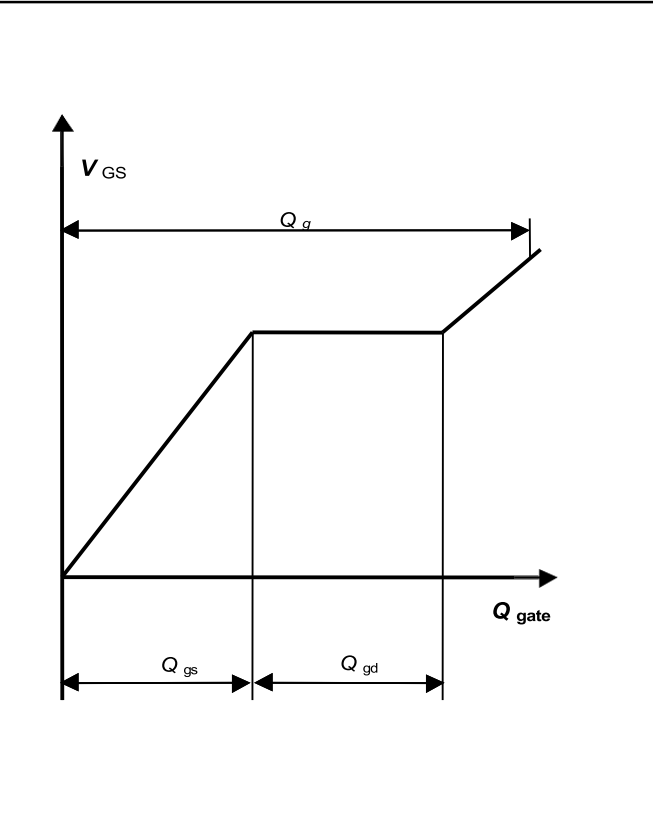


15 典型栅极电荷

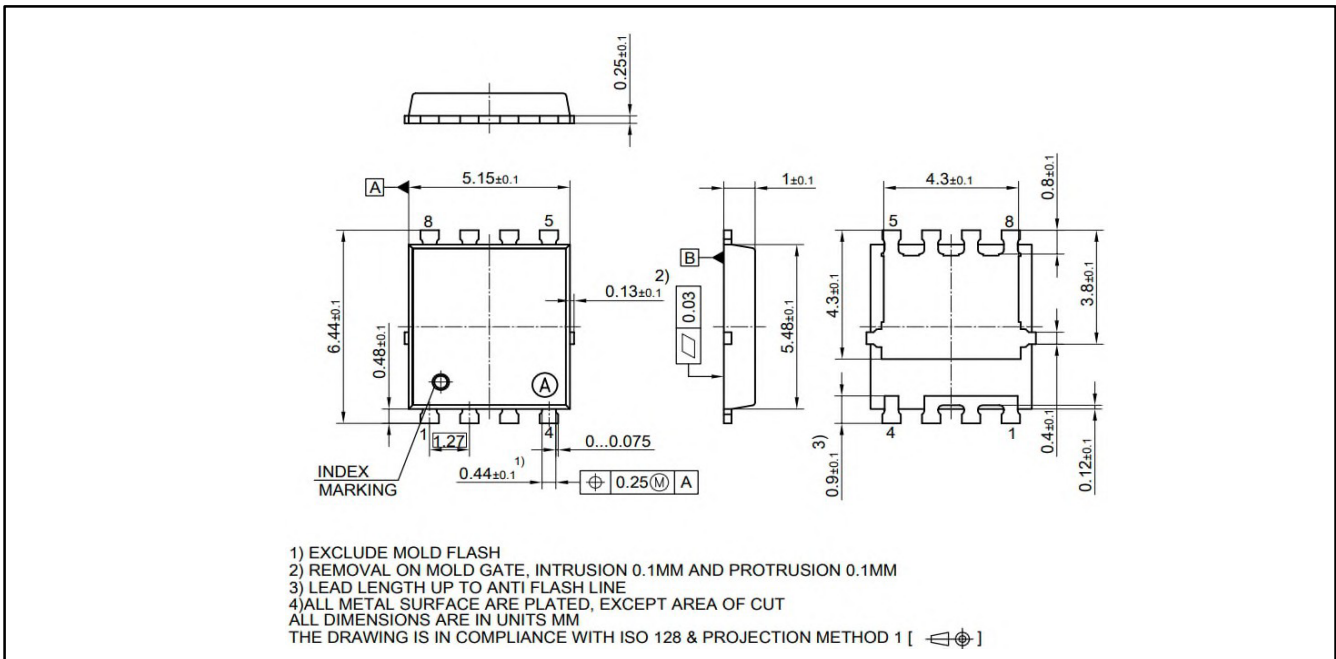
$V_{GS} = f(Q_{gate})$; $I_D = 88$ A pulsed; parameter: V_{DD}



16 栅极充电波形

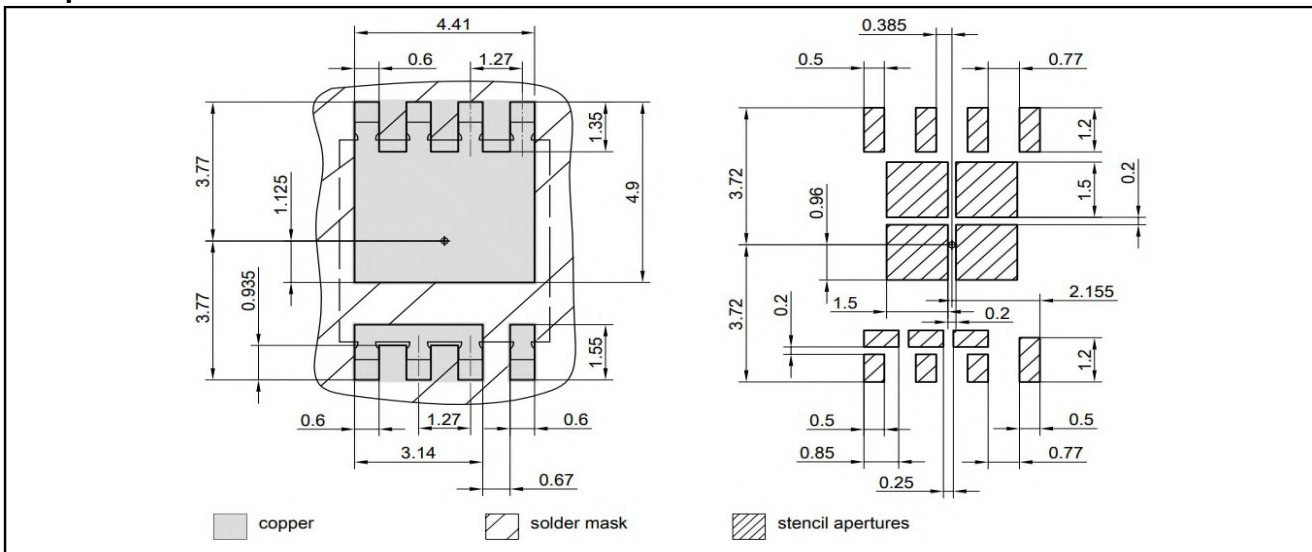


封装外形尺寸



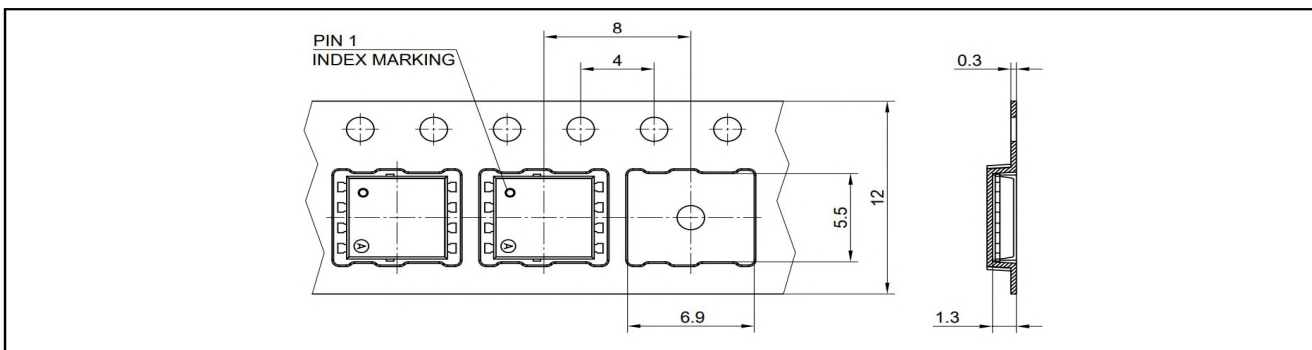
All dimensions are in units mm

Footprint



All dimensions are in units mm

包装外形



All dimensions are in units mm



修订记录

Revision	Date	Changes
Revision 1.0	15.11.2023	Final Data Sheet



免责声明

请注意，本文件的原文使用英文撰写，为方便客户浏览英飞凌提供了中文译文。该中文译文仅供参考，并不可作为任何论点之依据。

由于翻译过程中可能使用了自动化程序，以及语言翻译和转换过程中的差异，最后的中文译文与最新的英文版本原文含义可能存在不尽相同之处。

因此，我们同时提供该中文译文版本的最新英文原文供您阅读，请参见 <http://www.infineon.com>

英文原文和中文译文版本之间若存有任何歧异，以最新的英文版本为准，并且仅认可英文版本为正式文件。

您如果使用本文件，即表示您同意并理解上述说明。英飞凌不对因翻译过程中可能存在的任何不完整或不准确信息而产生的任何直接或间接损失或损害负责。英飞凌不承担中文译文版本的完整性和准确性责任。如果您不同意上述说明，请不要使用本文件。

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2025-03-11

Published by

Infineon Technologies AG

81726 Munich, Germany

© 2025 Infineon Technologies AG.

All Rights Reserved.

Do you have a question about this document?

Email:

erratum@infineon.com

重要提示

本文件所提供的任何信息绝不应被视为针对任何条件或者品质而做出的保证（质量保证）。英飞凌对于本文件中所提及的任何事例、提示或者任何特定数值及/或任何关于产品应用方面的信息均在此明确声明其不承担任何保证或者责任，包括但不限于其不侵犯任何第三方知识产权的保证均在此排除。此外，本文件所提供的任何信息均取决于客户履行本文件所载明的义务和客户遵守适用于客户产品以及与客户对于英飞凌产品的应用所相关的任何法律要求、规范和标准。

本文件所含的数据仅供经过专业技术培训的人员使用。客户自身的技术部门有义务对于产品是否适宜于其预期的应用和针对该等应用而言本文件中所提供的信息是否充分自行予以评估。

警告事项

由于技术所需产品可能含有危险物质。如需了解该等物质的类型，请向离您最近的英飞凌科技办公室接洽。

除非由经英飞凌科技授权代表签署的书面文件中做出另行明确批准的情况外，英飞凌科技的产品不应当被用于任何一项一旦产品失效或者产品使用的后果可被合理地预料到可能导致人身伤害的任何应用领域。